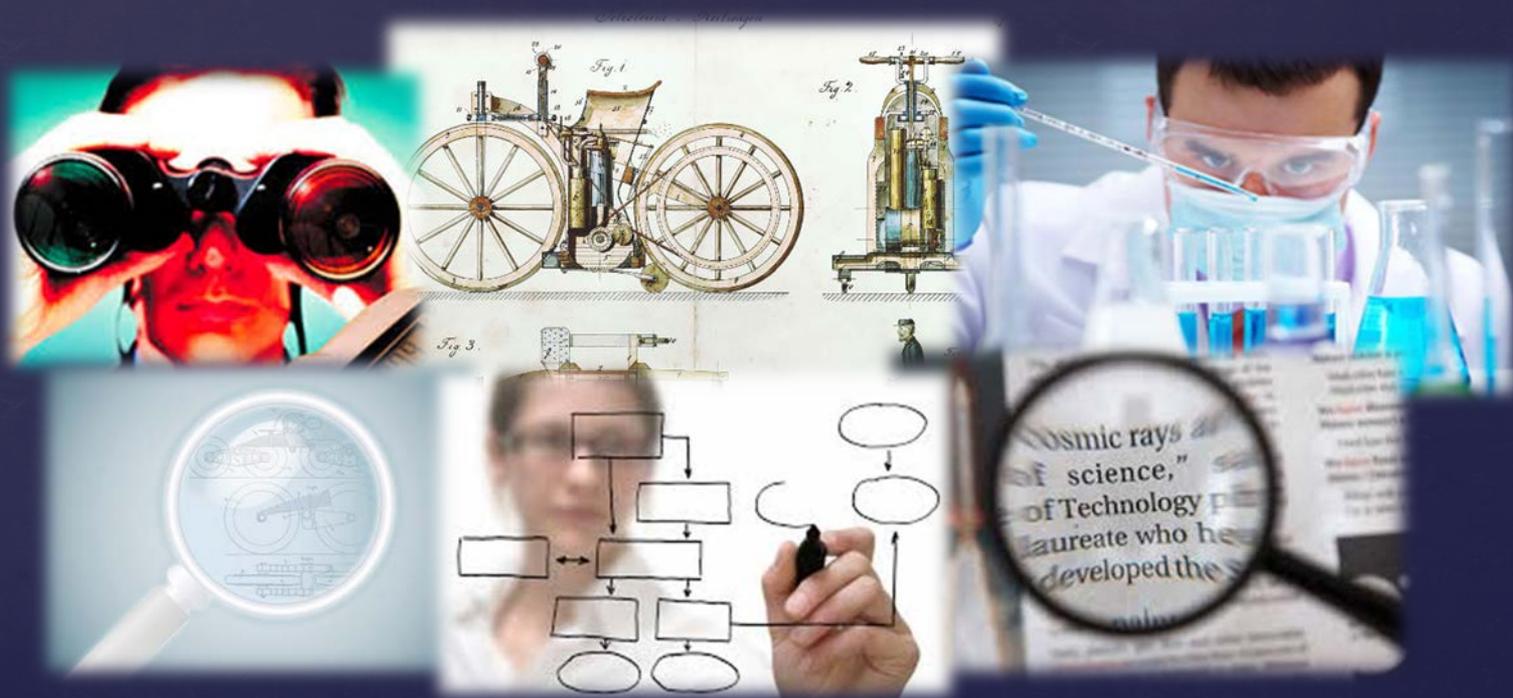


Патентные исследования при проведении НИР



Патентные исследования – это информационно-аналитические исследования на основе анализа источников патентной информации с привлечением других видов научно-технической информации

Исследования технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности (патентный ландшафт)

Исследования патентоспособности

Анализ патентной чистоты



Что позволяют узнать патентные исследования?

учесть технологические приоритеты, структуру портфелей НИОКР, ключевые инновации



определить текущий технический уровень рассматриваемой области



определить стратегию вывода и правовой охраны инновационной продукции (включая зарубежные рынки)



определить организации/исследователей обладающих технологиями/компетенциями



Поиск по открытым базам данных

1) Роспатент

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/

2) European patent office

http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP

3) World Intellectual Property Organization

<http://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf>

4) USA patent office

<http://patft.uspto.gov>

5) Google patents

http://www.google.com/advanced_patent_search



Коммерческие базы данных, ориентированные на построение патентных ландшафтов

- Global Patent Index
- PatStat (ЕПВ),
- Clarivate Innovation (компании Clarivate Analytics)
- Questel Orbit (компании Questel)
- PatBase (компании Minesoft)
- TotalPatent (компании LexisNexis)
- WIPS Global (Корея)
- PatSeer (компании Gridlogics)

Патентоспособность(охраноспособность) — совокупность свойств технического решения, без наличия которых оно не может быть признано изобретением на основе действующего в данной стране законодательства.



Патентная чистота — юридическое свойство объекта техники, заключающееся в том, что он может быть свободно использован в данной стране без нарушения исключительных прав, удостоверенных действующими на ее территории патентами, принадлежащими третьим лицам. Патентная чистота определяется только в отношении конкретных стран и только на определенную дату.



Чем отличается патентоспособность от патентной чистоты

Критерий	Патентоспособность	Патентная чистота
Глубина поиска документов	Все материалы до даты подачи заявки	Патенты, выданные за последние 20 лет
Документы для анализа	Все доступные опубликованные материалы	Действующие патенты
Цель	Минимизация риска отказа в выдаче патента, расходов на делопроизводство и оптимальное определение объёма правовых притязаний	Беспрепятственно производить и продавать разработанный продукт
География	Весь мир	Страны, в которых планируется производить и/или продавать продукт

Патентно-информационные исследования с оформлением отчета по ГОСТ Р15.011-96

Патентно-информационные исследования при осуществлении любых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также при осуществлении исследований, проводимых в рамках государственных заказов и государственных контрактов, в различных государственных учреждениях и научно-исследовательских институтах, проводят с оформлением отчета согласно **ГОСТ Р15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок исследования"**.

<http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=125689&pageK=68E502F1-B50C-40B9-9871-96F1407817F7>

п.4 ГОСТ Р15.011-96 определяет:

По своему характеру и содержанию патентные исследования относятся к прикладным научно-исследовательским работам и являются неотъемлемой частью обоснования принимаемых хозяйствующими субъектами решений народнохозяйственных задач, связанных с созданием, производством, реализацией, совершенствованием, использованием, ремонтом и снятием с производства объектов хозяйственной деятельности.

ГОСТ Р 15.011—96

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Система разработки и постановки
продукции на производство**

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Содержание и порядок

1 Область применения

Издание официальное

Настоящий стандарт распространяется на деятельность хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности, выполнение ими государственных заказов, хозяйственных договоров, инициативных работ, устанавливает единые требования к организации, проведению, оформлению и использованию результатов патентных исследований и применяется во всех отраслях народного хозяйства.

Содержание патентных исследований

- Исследование технического уровня объектов хозяйственной деятельности, выявление тенденций, обоснования прогноза их развития;
- Исследования состояния рынков данной продукции, сложившейся патентной ситуации, характера национального производства в странах исследования;
- Исследование требований потребителей к продукции и услугам;
- Исследования направлений научно-исследовательской и производственной деятельности организаций и фирм, которые действуют или могут действовать на рынке исследуемой продукции;
- Анализ коммерческой деятельности, включая лицензионную деятельность разработчиков (организаций и фирм), производителей (поставщиков) продукции и фирм, предоставляющих услуги, их патентной политики для выявления конкурентов, потенциальных контрагентов, лицензиаров и лицензиатов, партнеров по сотрудничеству;
- Выявление торговых марок (товарных знаков), используемых фирмой-конкурентом;
- Анализ деятельности хозяйствующего субъекта; выбор оптимальных направлений развития его научно-технической, производственной и коммерческой деятельности, патентной и технической политики и обоснование мероприятий по их реализации;

- Обоснование конкретных требований по совершенствованию существующей и созданию новой продукции и технологии, а также организации выполнения услуг; обоснование конкретных требований по обеспечению эффективности применения и конкурентоспособности продукции и услуг; обоснование проведения необходимых для этого работ и требований к их результатам;
- Технико-экономический анализ и обоснование выбора технических, художественно-конструкторских решений (из числа известных объектов промышленной собственности), отвечающих требованиям создания новых и совершенствования существующих объектов техники и услуг;
- Обоснование предложений о целесообразности разработки новых объектов промышленной собственности для использования в объектах техники, обеспечивающих достижение технических показателей, предусмотренных в техническом задании (тактико-техническом задании);
- Выявление технических, художественно-конструкторских, программных и других решений, созданных в процессе выполнения НИР и ОКР с целью отнесения их к охраноспособным объектам интеллектуальной собственности, в том числе промышленной;
- Обоснование целесообразности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности (в том числе промышленной) в стране и за рубежом, выбор стран патентования; регистрации;

- Исследование патентной чистоты объектов техники (экспертиза объектов техники на патентную чистоту, обоснование мер по обеспечению их патентной чистоты и беспрепятственному производству и реализации объектов техники в стране и за рубежом);
- Анализ конкурентоспособности объектов хозяйственной деятельности, эффективности их использования по назначению, соответствия тенденциям и прогнозу развития;
- Выявление и отбор объектов лицензий и услуг типа инжиниринг;
- Исследование условий реализации объектов хозяйственной деятельности, обоснование мер по их оптимизации;
- Обоснование целесообразности и форм проведения в стране и за рубежом коммерческих мероприятий по реализации объектов хозяйственной деятельности, по закупке и продаже лицензий, оборудования, сырья, комплектующих изделий и т.д.;
- Разработка рекомендаций по использованию товарных знаков при осуществлении коммерческой деятельности;
- Проведение других работ, отвечающих интересам хозяйствующих субъектов.

Процесс проведения патентных исследований
включает следующие этапы:

- определение задач и разработка заданий патентных исследований;
- разработка регламента поиска информации;
- поиск и отбор патентной и другой научно-технической информации в соответствии с утвержденным регламентом;
- систематизация и анализ отобранной информации;
- оформление результатов исследований в виде отчета о патентных исследованиях.

Приложение А (обязательное)

Форма задания на проведение патентных исследований

ПРИЛОЖЕНИЕ А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проекта
Ф.И.О.

«___» _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ № _____

НА ПРОВЕДЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВНИЙ

Наименование работы (темы) «Разработка и создание технологического комплекса прецизионной обработки оптических элементов (лазерного формирования сеток, масок, шкал, лимбов)» в рамках Государственного контракта № _____ от «___» _____ 20__ г.

В состав комплекса входит:

Раздел 1 - Лазерная технологическая рабочая станция на основе лазера с перестраиваемой длительностью импульсов (фемто - пико) (далее по тексту - ФПЛ) для микрообработки заготовок из оптического стекла и кристаллов, а также заготовок из оптического стекла с металлическим напылением и металлических фольг, с оснасткой для быстрой смены заготовок серийных изделий

Раздел 2 – Круговая прецизионная лазерная записывающая система для изготовления микроструктур различного назначения, описанных в полярной или прямоугольной системах координат

Раздел 3 - Сканирующий профилометр на основе хроматических конфокальных датчиков для контроля качества изготавливаемых микроструктур

Шифр работы (темы) «_____»

Сроки его выполнения «___» _____ 20__ г. – «___» _____ 20__ г.

Задачи патентных исследований: Анализ технического уровня и тенденций развития в исследуемой области, выявление патентов, представляющих интерес для выполнения работы.

Календарный план

Виды патентных исследований	Подразделения исполнители (соисполнители)	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения патентных исследований. Начало. Окончание	Отчетные документы
Анализ технического уровня и тенденций развития в исследуемой области, выявление патентов, представляющих интерес для выполнения работы	Лаборатория 07	Лаборатория 07 Ф.И.О.	Начало поиска «___» _____ 20__ г. Окончание поиска «___» _____ 20__ г.	Отчет о патентных исследованиях
	Лаборатория 06	Лаборатория 06 Ф.И.О.		
Анализ отобранных материалов. Проверка объекта на патентоспособность	Лаборатория 07	Лаборатория 07 Ф.И.О.	Начало «___» _____ 20__ г. Окончание «___» _____ 20__ г.	Отчет о патентных исследованиях
	Лаборатория 06	Лаборатория 06 Ф.И.О.		

Руководитель проекта _____ Ф.И.О. дата

Руководитель патентного подразделения _____ Ф.И.О. дата

Приложение Б (обязательное)

Форма регламента поиска

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Раздел 1

Регламент поиска № _____ «__» _____ 20__ г

Наименование работы (темы) «Лазерная технологическая рабочая станция на основе лазера с перестраиваемой длительностью импульсов (фемто - пико) для микрообработки заготовок из оптического стекла и кристаллов, а также заготовок из оптического стекла с металлическим напылением и металлических фольг, с оснасткой для быстрой смены заготовок серийных изделий»

Шифр работы (темы) «_____».

Номер и дата утверждения задания: № «__» _____ 20__ г.

Цель поиска информации: анализ технического уровня и тенденций развития в исследуемой области, выявление патентов, представляющих интерес для выполнения работы. Исследование направлений научных исследований и производственной деятельности организаций и фирм, которые действуют или могут действовать на рынке исследуемой продукции

Обоснование регламента поиска: Регламент поиска задан сроками выполнения НИР.

Начало поиска «__» _____ 20__ г. Окончание поиска «__» _____ 20__ г.

Предмет поиска (объект исследования, его составные части, товар)	Страна поиска	ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ПО КОТОРЫМ БУДЕТ ПРОВОДИТСЯ ПОИСК								Ретроспективность	Наименование информационной базы
		патентные		НТИ		конъюнктурные		другие			
		Наименование	Классификационные рубрики: МПК (МКИ) *МКПО*, НКИ* и др.	Наименование	Рубрики УДК* и другие	Наименование	Код товара ГС*, СМТК*, БТН*	Наименование	Классификационные индексы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<ul style="list-style-type: none"> • лазерная микрообработка • обработка стекла лазерным излучением • обработка материалов с помощью лазеров ультракоротких импульсов • системы прецизионной лазерной обработки • лазерные системы автофокусировки • laser micromachining • Laser autofocus 	RU US JP EU	Рефераты и полные описания к патентам	B23K26/04 B23K26/36 G02B26/08 G02B27/40 G02F1/29 H01S3/10	РЖ «Физика» Научное приборостроение, Applied Physics B, Opticalettera, Автометрия, Proc. of SPIE Laser Physics, Physical Review, Applied Optics, Review of scientific instruments, Специальная техника						Патентная документация 1993-2013	www1.fips.ru www.wipo.org http://gb.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=gb/EN/home.htm

Руководитель патентного подразделения _____ Ф.И.О. _____ 20__ г.

Руководитель проекта _____ Ф.И.О. _____ 20__ г.

Приложение В (обязательное)

Форма отчета о поиске

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Раздел 1

ФОРМА ОТЧЕТА О ПОИСКЕ

В.1.1 Поиск проведен в соответствии с заданием ИДЦ СО РАН, руководитель работ К.Т.Д. В.П. Бессмельцев.

№ 1 от 01 июня 2013 г. и Регламентом поиска № 1.1 от 01 июня 2013

В.2.1 Начало поиска 01 июня 2013 г. Окончание поиска 10 ноября 2013 г.

В.4.1 Поиск выполнен в соответствии и регламентом поиска.

В.5.1 Отслеживать состояние существующих патентов и разработок, аналогичных объекту исследования. Не реже одного раза за 6 месяцев проводить поиск по ключевым словам поиска

«лазерная микрообработка» в основных патентных базах, а также в научно-технических документах.

В.6.1 Материалы, отобранные для последующего анализа

Таблица В.6.1.1— Патентная документация

Предмет поиска (объект исследования, его составные части)	Страна выдачи, вид и номер охранного документа. Классификационный индекс	Заявитель (патентообладатель) страна. Номер заявки, дата приоритета, дата публикации	Название изобретения (полной модели, образца)	Сведения о действии охранного документа или причина его аннулирования (только для анализа патентной чистоты)
Laser micro-machining	США, пат. № 6057525 А В23К26/04, В23К26/18, В23К26/06, В23К26/16, В23К26/14, В23К26/38, В23К26/08	United States Enrichment Corporation, США Номер заявки: 08/926,657 Дата приоритета: 5.09.1995 Дата публикации: 2.05.2000	Method and apparatus for precision laser micromachining	Действителен
	США, пат. № 6008943 G02B27/09, В23К26/06, G02B5/02	Gregory Metelitsa, Номер заявки: 08/979,351 Дата приоритета: 26.11.1997 Дата публикации: 28.12.1999	Laser optical system for micromachining	Действителен
	США, пат. № 6555731 B2 G03F 1/00, В23К26/073, B08B7/00, В23К26/06, В23К26/08, В23К26/38, G02F1/33	Nanyang Technological University, Сингапур Номер заявки: 09/898,454 Дата приоритета: 10.05.1999 Дата публикации: 29.04.2003	Ultrashort pulsed laser micromachining/submicromachining using an acousto-optic scanning device with dispersion compensation	Действителен
	США, пат. №7611966 B2	Intel Corporation, США	Dual pulsed beam laser micromachining method	Действителен

Т а б л и ц а В.6.2 - Научно-техническая, конъюнктурная, нормативная документация и материалы государственной регистрации (отчеты о научно-исследовательских работах)

Предмет поиска	Наименование источника информации с указанием страницы источника	Автор, фирма (держатель) технической документации	Год, место и орган издания (утверждения, депонирования источника)
лазерная микрообработка	ВЕСТНИК КОМПЬЮТЕРНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ, с. 48-52	Бессмельцев В.П., Голошевский Н.В., Смирнов К.К.	2009, Издательский дом "Спектр" (Москва)
	Автометрия, С. 98-106.	Бессмельцев В.П., Голошевский Н.В., Смирнов К.К.	2010, Издательство Сибирского отделения РАН (Новосибирск)
	Известия высших учебных заведений. Приборостроение. С. 17-21	Бессмельцев В.П., Бушуев Е.Д., Голошевский Н.В.	2011, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Санкт-Петербург)
	Интерэкспо Гео-Сибирь С. 32-38	Бессмельцев В.П.	2013, Сибирская государственная геодезическая академия (Новосибирск)
обработка стекла лазерным излучением	ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ, с. 74-80	БЛОНСКИЙ И.В., ДАНЬКО А.Я., КАДАН В.Н., ОРЕШКО Е.В., ПУЗИКОВ В.М.	2005, Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" РАН (Санкт-Петербург)
laser micromachining	AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS, MICRO-ELECTROMECHANICAL SYSTEMS DIVISION PUBLICATION (MEMS) С. 83-87	BULUSU A., JOSHI S.P., SHIAKOLAS P.S.	2003, ASME International Mechanical Engineering Congress. Ser. "Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS)
	SEIMITSU KOGAKU KAISHI/JOURNAL OF THE JAPAN SOCIETY FOR PRECISION ENGINEERING С. 943-946	OBARA M.	2006, Seimitsu Kogakai/The Japan Society for Precision Engineering
	SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO. BOLETIN	MENDEZ C., GARCIA A., ARIAS I., CONEJERO E., ROSO L.,	2005, SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO. BOLETIN

Таблицы В.6.4, В.6.5, В.б.б заполняются в случае, если заданием на проведение патентных исследований предусмотрена статистическая обработка отобранных охранных документов.

Таблица В.б. 4— Количество опубликованных охранных документов по годам (изобретательская активность)

Объект техники и его составные части	Страна подачи заявки	Количество патентов, опубликованных заявок по годам подачи заявки (исключая патенты-аналоги)				
		3	4	1	5	5
1	2	3	4	1	5	5

Количество лет при необходимости

Таблица В.б.б.— География патентования объектов промышленной собственности исследуемыми фирмами (по патентам-аналогам)

Наименование фирмы-патентовладельца	Наименование технического решения (изобретения)	Номер первичной заявки	Дата приоритета	Дата публикации первичной заявки	Номера выданных патентов (поданных заявок) по странам выдачи														
					6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11	1	12	1	13
1	2	3	4	5	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11	1	12	1	13

Таблица В.6.5— Взаимное патентование

Национальная принадлежность заявителя	Страна патентования								Специальных патентов	использовано в других странах	
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8			
]	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	3	4	5

Всего выдано патентов
В том числе иностранным заявителям

Отчет о патентных исследованиях должен содержать:

- титульный лист;
- список исполнителей;
- содержание;
- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц, терминов;
- общие данные об объекте исследований;
- основную (аналитическую) часть;
- заключение;
- приложения;
- описания изобретений, аннотации документов и другие справочные материалы, отобранные при проведении поиска.

Общие данные об объекте исследований должны содержать:

- даты начала и окончания работы (год, месяц);
- краткое описание объекта, его назначение, область применения.

Общие данные об объекте исследований

Объектом данных патентно-информационных исследований являются способы и устройства для круговой лазерной записывающей системы по теме «Разработка и создание технологического комплекса прецизионной обработки оптических элементов (лазерного формирования сеток, масок, шкал, лимбов)», являющиеся предметом НИР, который выполняется в рамках Государственного контракта № _____ от «___» _____ 20__ г., шифр «___». Раздел 2 комплекса: «Круговая прецизионная лазерная записывающая система для изготовления микроструктур различного назначения, описанных в полярной или прямоугольной системах координат». Отчет является сопровождением указанной НИР.

Системный отбор и анализ отечественной и зарубежной патентной документации производится с глубиной 20 лет.

Развитие современной оптики связано с совершенствованием ее элементной базы. Основу этой базы составляют - линзы, объективы, призмы, зеркала и т.д., которые с позиции волновой оптики рассматриваются как пространственные фазовые модуляторы света. Аналогичный эффект фазовой модуляции может быть получен с использованием тонких фазовых пластинок с вариацией оптической толщины, лежащей в пределах длины волны света. Такие пластинки получили название дифракционных оптических элементов (ДОЭ), синтезированных голограмм, фокусаторов, кинорформов, а соответствующая область науки - дифракционной оптики

Такие элементы в отличие от оптических голограмм при освещении монохроматической световой волной дают единственный дифракционный порядок, и весь падающий световой поток идет на создание полезного изображения. ДОЭ может осуществлять различные функциональные преобразования световых полей, выполнять функции сложного многолинзового объектива, коррекцию сферических или хроматических aberrаций и т.д. Использование плоских элементов в оптических схемах, особенно использование монохроматических лазерных источников света, открывает перспективу создания дешевых, компактных и функционально сложных приборов.

Дифракционная оптика не является конкурентом традиционной оптики. Как и большинство перспективных технологий, она предоставляет новые возможности в

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

Раздел 1.

Дата начала работ: «___» _____ 20__ г.

Дата окончания работ: «___» _____ 20__ г.

Патентное исследование осуществлялось в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 для выполнения по государственному контракту № ___ от «___» _____ 20__ г.

Объект исследования:

Объектом исследования являются прототипы установок микрообработки, основанных на методе комплементарного сканирования лазерного луча, предназначенных для прецизионной микрообработки деталей, основные узлы таких установок, а так же методы и принципы обработки изделий из стекла и различных сплавов, позволяющие получить изделия, удовлетворяющие требованиям указанным в техническом задании.

Принцип функционирования:

Принцип работы системы заключается в по кадровом сканировании изделия, представляющего собой подложку из стекла или мембрану из листового металла, лазерными импульсами ультракороткой длительности, с целью прецизионной микрообработки и формирования на ее поверхности маски с высокой точностью взаиморасположения ее элементов.

Назначение:

Установка предназначена для производства элементов оптических устройств широкого спектра назначения.

Область применения:

Серийное и малосерийное производство оптических устройств широкого спектра.

Основная (аналитическая) часть отчета о патентных исследованиях в общем случае включает в себя:

- Технический уровень и тенденции развития объекта хозяйственной деятельности;
- Использование объектов промышленной (интеллектуальной) собственности и их правовую охрану;
- Исследование патентной чистоты объекта техники;
- Анализ деятельности хозяйствующего субъекта и перспектив его развития (Приложение Г).

Включение конкретных разделов в основную (аналитическую) часть отчета о патентных исследованиях определяется заданием на проведение патентных исследований!

Приложение Г (рекомендуемое).

Анализ деятельности хозяйствующего субъекта и перспектив его развития

1. Обоснование необходимости проведения конкретных работ хозяйствующим субъектом и требований к их результатам.

- Анализ научной и производственной деятельности в динамике.
- Анализ коммерческой деятельности в динамике.
- Перспективы развития деятельности хозяйствующего субъекта.
- Выбор оптимальных направлений развития деятельности хозяйствующего субъекта.
- Обоснование конкретных работ по развитию деятельности хозяйствующего субъекта по выбранным направлениям.

2. Оценка условий реализации продукции и услуг на момент окончания работ.

- Анализ соответствия результатов выполненных работ ранее сформулированным требованиям.
- Оценка рынка, наличие спроса на продукцию и услуги, его объем, деятельность конкурентов.
- Меры по обеспечению беспрепятственной реализации продукции и ее расширению.

При необходимости разделы основной (аналитической) части отчета о патентных исследованиях иллюстрируют таблицами, расчетами, в том числе приведенными в приложении Д

Приложение Д

Определение патентной чистоты объекта исследований

Объект техники, его составные части (в том числе технические, художественно-конструктивные) подлежащие экспертизе на патентную чистоту

Д.3.1.1.

Наименование объекта техники и его составных частей	Обозначение (чертежей, ГОСТ, ТУ и т.д.). Дата утверждения чертежа	Страна, в которой проводится исследование патентной чистоты	Источники известности		Действующие охранные документы (в том числе патенты-аналоги, выложенные и акцептованные заявки), подлежащие анализу	Сопоставительного анализа с объектом промышленной собственности («Подлежит» — «Не подлежит»)	
			Научно-техническая документация (наименование источника, дата публикации)	Охранные документы: патенты, выложенные и акцептованные заявки (номер документа, даты приоритета и публикации, название объекта промышленной собственности, другие библиографические данные)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Способ повышения точности оценки основных характеристик ожидаемого сильного цунамигенного землетрясения (местоположение, время и магнитуда)		РФ		Патент №2355000 RU Действует с 21.11.2007 Регистрационный номер заявки: 2007142680 Опубликовано: 10.05.2009 Страна приоритета RU Способ оперативного прогноза места готовящегося землетрясения	Действует	Подлежит	
				Патент №2298818 RU Действует с 27.01.2006 Регистрационный номер заявки: 2006102220 Опубликовано: 10.05.2007 Страна приоритета: RU Способ прогноза землетрясений	Действует	Подлежит	
				Патент № 2370790RU Действует с 19.06.2008 Регистрационный номер заявки: 2008124041 Опубликовано: 20.10.2009 Страна приоритета: RU Способ определения времени, места и магнитуды землетрясения.	Действует	Подлежит	
				Патент № 2335000RU Действует с 22.03.2007 Регистрационный номер заявки: 2007110394 Опубликовано: 27.09.2008 Страна приоритета: RU Система измерений предвестника землетрясений.	Действует	Подлежит	
				Регистрационный номер заявки: 99127427 Опубликовано: 20.10.01	Действует	Не подлежит	Нет данных

Сопоставительный анализ объекта техники с охраняемыми объектами промышленной собственности

Наименование использованных в объекте технических и художественно-конструкторских решений, подлежащих анализу (обозначение чертежей, ГОСТ и т.д.)	Страна выдачи охранного документа, документа, вид промышленной собственности, число пунктов патентной формулы, подлежащих анализу	Сопоставляемые признаки		Выводы		
		по охранному документу (по каждому из признаков пункта патентной формулы). Номер пункта патентной формулы	по объекту техники	по каждому признаку пункта формулы	по пункту формулы	по охранному документу в целом
1	2	3	4	5	6	7
Способ повышения точности оценки характеристик сильного цунамигенного землетрясения (местоположение, время и магнитуда), основанный на инструментальных данных комплексного сейсмического мониторинга очаговой области и специальной обработки данных каталога индикаторных сейсмических событий (форшюков), путем выявления и контроля прогностических признаков.	<p>Патент на изобретение №2355000 RU 1 независ. пункт ФИ Действует с 21.11.2007 Регистрационный номер заявки: 2007142680 Опубликовано: 10.05.2009 Страна приоритета RU Способ оперативного прогноза места готовящегося землетрясения</p>	<p>Способ оперативного прогноза места готовящегося землетрясения, включающий установку по меньшей мере на трех сейсмических станциях сейсмической аппаратуры, фиксирование предвестников землетрясения и определение места землетрясения, отличающийся тем, что на каждой сейсмической станции устанавливаются пара идентичных с многоделестковыми диаграммами чувствительности гравитационных вариометров, расположенных под углом друг к другу, не кратным 90° и ориентированных по сторонам света с начальными углами ориентации, при изменении положений коромысел гравитационных вариометров определяют изменения углов относительно углов их начальной ориентации с последующим определением по диаграмме чувствительности и величине изменения угла ориентации каждого прибора направления на очаг готовящегося землетрясения, при этом место очага определяют путем пересечения направлений на этот очаг, полученных, по меньшей мере, с трех сейсмических станций.</p>	В проверяемом объекте не использован ни один признак	Признак не использован	Пункт формулы не использован	Патент не использован
	<p>Патент на изобретение №2298818 RU 1 независ. пункт ФИ Действует с 27.01.2006 Регистрационный номер заявки: 2006102220</p>	<p>Способ прогноза землетрясений, включающий выявление сейсмоопасной территории с разломами в земной коре, получение с летательного аппарата изображения подстилающей поверхности сейсмоопасной территории в виде зависимости амплитуды $A(x, y)$ уходящего потока инфракрасного излучения от пространственных координат,</p>	В объекте не использован ни один признак	Признаки не использованы	Пункт формулы не использован	Патент не использован

Приложение Д (рекомендуемое)

Форма Д.1.1. Показатели технического уровня объекта техники

Наименование показателя*	Значения показателей											Объект по государственному стандарту	Международные и национальные стандарты	Прогноз на ___ г.	
	Отечественные и зарубежные объекты аналогичного назначения (с указанием моделей фирм, стран, года известности)														
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10					
1	2												4	5	6

Включают показатели, оказывающие влияние на результаты деятельности хозяйствующего субъекта:
 технико-экономические;
 эффективности использования по назначению;
 технические;
 эргономические;
 экологические; безопасности и т.д.

Форма Д.1.2 Тенденции развития объекта исследования

Выявленные тенденции развития объекта исследования	Источники информации	Технические решения, реализующие тенденции	
		в объектах организаций (фирм)	в исследуемом объекте

Форма Д.2.2 Оценка патентоспособности вновь созданных технических и художественно-конструкторских решений, определение целесообразности их правовой охраны

Название технических, художественно-конструкторских решений, преявляемых к правовой охране	Сущность решений, предлагаемых к правовой охране	Прототипы решений, предлагаемых к правовой охране	Достигаемый технический результат и его влияние на характеристики объекта хозяйствен-	Патентоспособность и квалификация предложенных решений (возможность отнесения к изобретениям)	Целесообразность правовой охраны и обоснование выбора стран патентования или причина отказа от

Форма Д.2.1 Анализ применимости в объекте исследований известных объектов промышленной (интеллектуальной) собственности *

Вид промышленной собственности, наименование объекта промышленной собственности. Патентообладатель (страна, фирма)	Номер охранного документа, классификационный индекс, номер и дата подачи заявки (страна, номер конвенционного приоритета) и другие bibliографические данные	Наименование составных частей объекта исследования, в которых могут быть использованы объекты промышленной собственности	Оценка влияния использованных объектов промышленной собственности на характеристики объекта исследования	Возможность и целесообразность использования объекта промышленной собственности (в т.ч. приобретения лицензии) или причины отказа от использования	
1	2	3	4	5	6

Результаты анализа применимости в объекте исследований известных объектов интеллектуальной собственности в отчете могут быть представлены в произвольной форме.

Форма Д.2.3 Правовая охрана объекта исследования с экономической оценкой использования объектов промышленной собственности

Вид промышленной собственности, наименование объекта промышленной собственности. Патентообладатель (страна, фирма)	Библиографические данные охраняемых документов, полученных в стране и за рубежом, и поданных патентных заявок (страна; вид документа; даты приоритета, выкладки, выдачи патента, публикации, классификационный индекс)	Наименование Библиографические частей объекта исследования, в которых используются объекты промышленной собственности (с указанием чертежа или другого документа)	Экономическая оценка использования объектов промышленной собственности в объекте исследования	Примечание *
1	2	3	4	5

* Приводятся сведения о решениях по поданным заявкам на получение охраны промышленной собственности

Заключение

В рамках настоящего раздела 2 «Круговая прецизионная лазерная записывающая система для изготовления микроструктур различного назначения, описанных в поверной или прямоугольной системах координат по проекту «Разработка и создание технологического комплекса прецизионных оптических элементов» исследовались методы и устройства для изготовления фотошаблонов, оптических шкал на вращающемся диске.

Произведена проверка соответствия модели изобретения патентной зоне.

По результатам проведенного патентного поиска выявлены известные из уровня техники решения ДОО, а именно способы и устройства для изготовления ДОО.

Настоящие патентные исследования выявили, что в области разработки устройств для лазерной записи дифракционных элементов отсутствует устройство с подложкой. Стоит отметить, что разработанное устройство защищено патентом РФ. Также защищены патентами на устройства для изготовления микроструктур, например патентом обладателем которого является автор настоящего заключения лицензионных договоров или иных сделок.

Проведенные патентные исследования соответствуют уровню техники и тенденциям развития исследований в области систем лазерной записи для изготовления микроструктур, изучены технические решения, исполненные в виде устройств, и особенности этих решений. Разработанные устройства в результате ее выполнения разрабатываются как устройства для изготовления микроструктур различного назначения соответствующие патентной зоне.

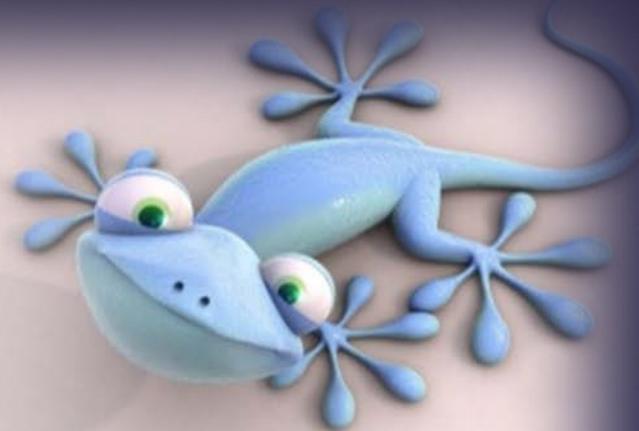
105

Рекомендуется проведение дальнейших исследований в области разработки устройств для лазерной записи дифракционных элементов, а именно устройств с подложкой, устройств для изготовления микроструктур, например патентом обладателем которого является автор настоящего заключения лицензионных договоров или иных сделок.

Рекомендуется проведение дальнейших исследований в области разработки устройств для лазерной записи дифракционных элементов, а именно устройств с подложкой, устройств для изготовления микроструктур, например патентом обладателем которого является автор настоящего заключения лицензионных договоров или иных сделок.

В заключении в общем случае приводят:

- обобщенные выводы по результатам проведенных патентных исследований;
- оценку состояния выполнения работы, составной частью которой являются патентные исследования (например, НИР и ОКР), в свете соответствия его требованиям к конечным результатам работы, целям, планам, программам, перспективам деятельности предприятия (организации);
- предложения по использованию результатов патентных исследований для совершенствования научно-технической, производственной продукции, услуг и развития деятельности предприятия (организации).



Спасибо за внимание!